Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0218U003441

Державний реєстраційний номер: 0115U005035

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-02-2018

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 4

Назва етапу: "Сертифікація розроблених методик рентгеноструктурної діагностики матеріалів, структур та приладів для потреб сучасних технологій та їх метрологічний супровід"

Початок етапу: 01.2017

Закінчення етапу: 12.2017

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 525-40-20, 525-83-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 150

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розроблення і створення високороздільних рентгенівських методів і обладнання для сертифікації нанорозмірних матеріалів

Назва роботи англійською:

Development and creation of high-resolution X-ray methods and equipment for certification of nanomaterials

Реферат українською:

Перевірені різні методики рентгенівського аналізу халькогенідних стекол As2Se3, легованих марганцем. Протестоване програмне забезпечення рентгенівських методик контролю характеристик досліджуваних об'єктів на об'єктах як кристалічної, так і аморфної структури. Досліджена структура, розмір та деформаційний стан нанокристалів різних матеріалів вбудованих в аморфну матрицю на основі квантових точок CdS. Проведено випробування розроблених методик на різних етапах технологічних процесів виготовлення наноматеріалів та приладних структур на їх основі.

Реферат англійською:

Different methods of X-ray analysis of manganese doped chalcogenide glass As2Se3 have been tested. Proven software of X-ray methods for controlling the characteristics of investigated objects on objects of both crystalline and amorphous structure. The structure, size and deformation state of nanocrystals of various materials embedded in an amorphous matrix on the basis of quantum dots of CdS are investigated. The tests of developed techniques at different stages of technological processes of nanomaterials and instrumental structures on their basis have been tested.

Індекс УДК: 621.315.5/.6; 621.318.1; 666.65, 62.382.2017.7; 621.397.579.017

Коди тематичних рубрик: 47.09

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кладько Василь Петрович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор, член-кор.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Сертифікація розроблених методик рентгеноструктурної діагностики матеріалів, структур та приладів для потреб сучасних технологій та їх метрологічний супровід

Назва НТП англійською: Certification of developed methods of X-ray structural diagnostics of materials, structures and devices for the needs of modern technologies and their metrological support.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: 72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Сертифікація розроблених методик рентгеноструктурної діагностики матеріалів, структур та приладів для потреб сучасних технологій та їх метрологічний супровід

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: -

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: НАН України

Перспективні ринки: Україна

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Бєляєв Олександр Євгенович
д. ф.-м. н., 01.04.10

Перелік осіб-виконавців

Гудименко Олександр Йосипович

Кривий Сергій Борисович

Максименко Зоя Василівна

Поліщук Юлія Олегівна

Сафрюк Надія Володимирівна

Слободян Микола Васильович

Станчу Григорій Вікторович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

